

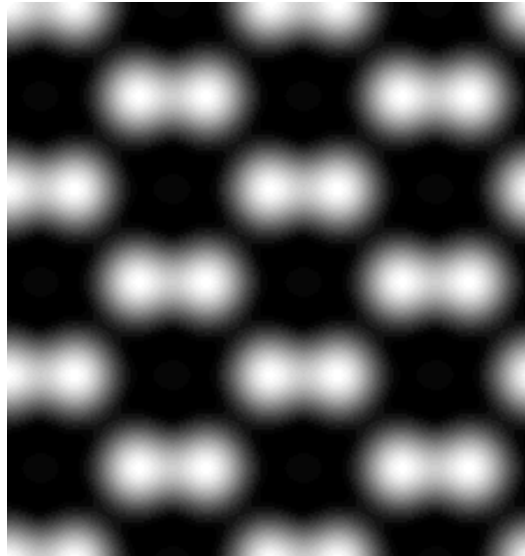
*Optional
Function*

STEM

for *MacHREM*TM / *WinHREM*TM

Scanning Transmission Electron Microscope
Image Simulation Program

走査型透過電子顕微鏡像 シミュレーションプログラム



GaAs [011] の HAADF 像

このプログラムは走査型透過電子顕微鏡像を計算するもので、高分解能電子顕微鏡像のシミュレーションのためのプログラムである *MacHREM*TM / *WinHREM*TM の拡張機能として追加されたものです。明視野像、暗視野像、さらに最近注目されています高角度散乱暗視野像 (HAADF STEM) を計算することができます。

- 使いやすいユーザーインターフェース

初心者でも容易にデータ作成、計算の実行を行うことができます。

- 信頼のおけるアルゴリズム

*MacHREM*TM / *WinHREM*TM で採用されているマルチスライス法にもとづく動力的散乱計算を基本としています。

- 高品位な画像出力

Mac OS / Windows の標準画像フォーマットで高品位な濃淡像を生成し、印刷、他のアプリケーションへのコピーが可能です。

お問い合わせ先

有限会社 HREM (HREM Research Inc.)

〒355-0055 埼玉県東松山市松風台 14-48

email: support@hremresearch.com

東京事務所：千代田区 2 番町 11-10-503



文献: K. Ishizuka: A practical approach for STEM image simulation based on the FFT multislice method, Ultramicroscopy 90 (2002) 71-83.